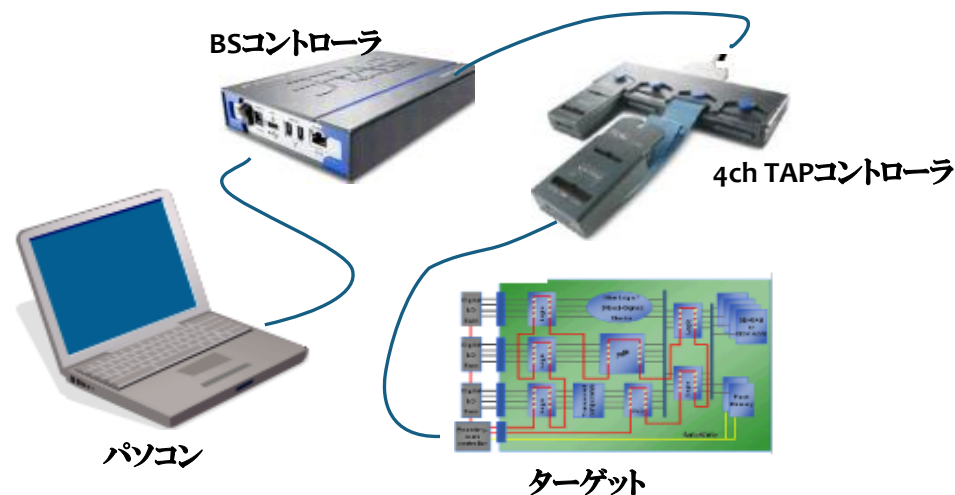


**BGAデバイス搭載基板の  
品質向上を実現する  
JTAGバウンダリスキャン  
テスターのご紹介**

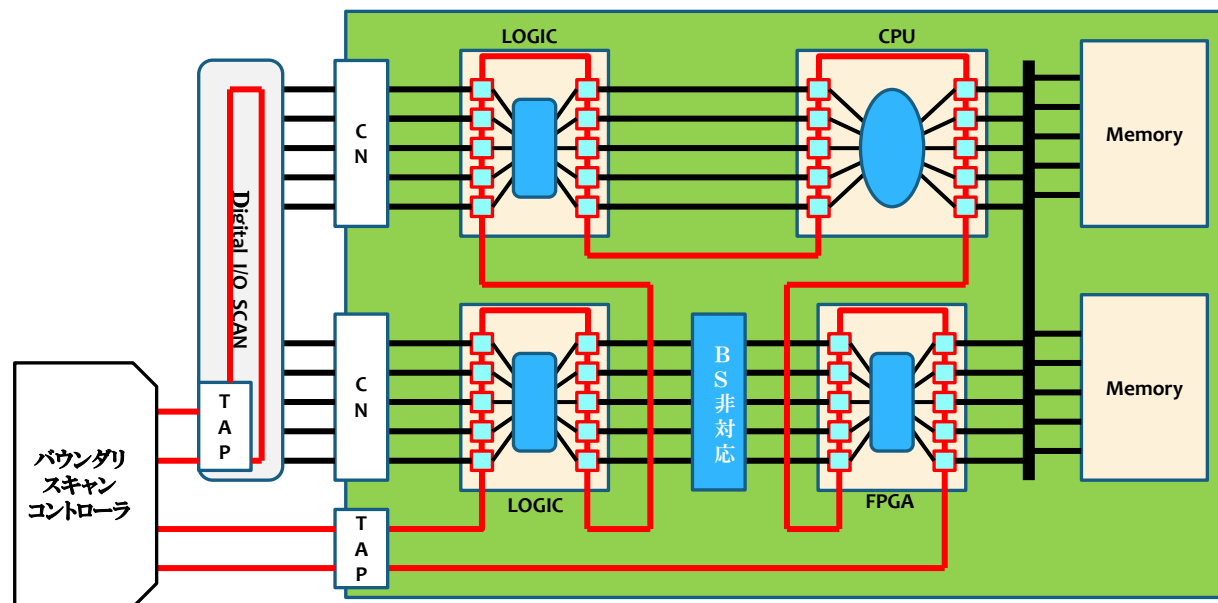
# JTAGバウンダリスキャンテスター とは① (JTAG Boundary Scan Tester)

JTAGバウンダリスキャンテスターは、  
基板に電源を供給しバウンダリスキャンデバイスの  
専用端子を使用し入出力信号の制御を行い  
バウンダリスキャン対応デバイスおよび周辺ICの  
接続状態を検査することが出来る装置です。



# JTAGバウンダリスキャンテスター とは② (JTAG Boundary Scan Tester)

- インサーキットテスター用のプローブピンが接触できないような高密度な基板でも、制御端子を使う事で検査可能とする検査治具。
- バウンダリスキャン対応デバイスが実装され、テスト用に回路設計がされている必要があります。



# 検出可能な不良例

- バウンダリスキャン対応IC、  
及び周辺ICの実装不良  
(欠品、方向違い、異品など)
- バウンダリスキャン対応ICの  
リードはんだ付け不良  
(未はんだ、ショート、ボール欠損など)

# おすすめする理由

- インサーキットテスターやファンクションテスターだけでは検出できない不具合を発見することによる品質の向上。
- 高密度化が進んでいく基板の品質保証体制の確保。例えば、不具合発生時の解析能力の向上。

# 当社でできること

- JTAGバウンダリスキャン検査のためのプログラム開発から治具製作、デバッグまで出来ます。

